



儀器中文名稱：高解析度場發射掃描式電子顯微鏡 7900F

儀器英文名稱：Field Emission Scanning Electron Microscope 7900F

儀器英文簡稱：FESEM 7900F

儀器設備說明：

- 購置時間：107 年
- 放置地點：工程一館 120 實驗室 (E1-120 Lab)
- 廠牌型號：JEOL 7900F
- 規格:

(1)加速電壓：0-30 KV

(2)解析度(SEI)：高解析影像條件 0.7 nm (15 KV)

(3)放大倍率：x25 to x1,000,000

(4)影像輸出：燒錄數位影像紀錄

(5)能量分散光譜儀 (EDS oxford ultim max 100):元素偵測範圍:Be~U (原子序 4~92) ,
解析度:127 eV

(6)電子背向散射繞射儀 (EBSP oxford)：結晶方位分析 (依據菊池線分析)、微區
晶相圖像、晶軸及反晶軸圖像

(7)波長分散光譜儀 (WDS oxford)：元素偵測範圍:B~U (原子序 5~92)

樣本製備要求：

- 不接受揮發性物質,有機物質,有毒物質,未固化之粉末試樣。
- SEI 及 EDS 試片尺寸：直徑 25mm,高度 5mm
- EBSP 試片尺寸:直徑 10mm,高度 5mm。
- 樣品保持清潔及乾燥，油汙及腐蝕液須清洗乾淨並烘乾。

• 時段收費(使用科技部計畫預約)：

(1) 1 時段/3 小時預約：基本費 900 元，每一時段以 3 小時計，未滿者亦以一
時段計費。

• 分析收費:

EDS：半定量分析每件樣品加收 50 元。

WDS：定量分析每件樣品加收 100 元。

EBSD：每小時加收 200 元。

• 非科技部時段採計時收費：校內每小時現金 300 元、校外每小時現金 1,200 元

開放服務對象：校內、校外學術單位及產業界

聯絡資訊：

• 儀器負責教授: 王丞浩 教授

TEL:(02)2730-3715

E-mail: chwang@mail.ntust.edu.tw

• 儀器負責技術員: 廖勝權 先生

TEL:(02)2733-3141#6435/#7375/#3793

E-mail: sclaiw@mail.ntust.edu.tw